

Боргардт Николай Иванович

доктор физико-математических наук, профессор

заведующий кафедрой общей физики

начальник лаборатории электронной микроскопии Национального
исследовательского университета "Московский институт электронной
техники" МИЭТ

адрес: Россия, Москва, Зеленоград, площадь Шокина, дом 1, индекс: 124498

тел.: 8(499)720 8558

e-mail: borgardt@miee.ru

Список

публикаций Н.И. Боргардта

1. Гришина Я. С., Боргардт Н. И., Волков Р. Л., Громов Д. Г., Дубков С. В. Электронно-микроскопические исследования кристаллитов в углеродных наностолбиках, выращенных методом плазмостимулированного химического осаждения // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – 2017. – №. 2. – С. 51-59.
2. Borgardt N. I., Rumyantsev A. V. Prediction of surface topography due to finite pixel spacing in FIB milling of rectangular boxes and trenches // Journal of Vacuum Science & Technology B. – 2016. – Vol. 34. – №. 6. – С. 061803.
3. Kashammer P., Borgardt N.I., Seibt M., Sinno T. Quantitative assessment of molecular dynamics-grown amorphous silicon and germanium films on silicon (111) // Surface Science. – 2016. – Vol. 651 – P. 100–104.
4. Боргардт Н.И., Приходько А.С., Зайбт Влияние атомарной структуры базисных плоскостей на межплоскостное расстояние в пиролитических углеродных материалах // Письма в ЖТФ. – 2016. – Т 42. – Вып. 23. – С. 1–8.
5. Боргардт Н.И., Волков Р.Л., Румянцев А.В., Чаплыгин Ю.А. Моделирование распыления материалов фокусированным ионным пучком // Письма в ЖТФ. 2015. Т. 41. Вып. 12. С. 97-104.
6. Ловыгин М.В., Боргардт Н.И., Казаков И.П., Зайбт М. Электронно-микроскопические исследования слоя алюминия, выращенного на вицинальной поверхности подложки арсенида галлия // Физика и техника полупроводников. – 2015. – Т. 49. – Вып. 3. – С. 349-356.
8. Lovygin M.V., Borgardt N.I., Kazakov I.P., Seibt M. Structural studies of Al thin layer on misoriented GaAs(100) substrate by transmission electron microscopy // physica status solidi (c). 2015. Vol. 12. № 8. P. 1148-1151.
9. Prikhodko A.S., Borgardt N.I., Seibt M. Turbostratic pyrocarbon structure study by means of exit wave reconstruction from high-resolution transmission electron microscopy // physica status solidi (c). 2015. Vol. 12. № 8. P. 1179-1182.
10. Shilyaeva Yu.I., Bardushkin V.V., Gavrilov S.A., Silibin M.V., Yakovlev V.B., Borgardt N.I., Volkov R.L., Smirnov D.I., Zheludkevich M.L. Melting temperature of metal polycrystalline nanowires electrochemically deposited into the pores of anodic aluminum oxide // Physical Chemistry Chemical Physics. – 2014. – Vol. 16. – P. 19394–19401.
11. Thiel K., Borgardt N.I., Plikat B., Seibt M. Mesoscopic properties of interfacial ordering in amorphous germanium on Si(111) determined by quantitative digital image series matching // Ultramicroscopy. 2013. Vol. 126 P.1-9.
12. Волков Р.Л., Боргардт Н.И., Кукин В.Н. и др. Исследование субмикронных полостей в углеситалле методом фокусированного ионного пучка // Письма в журнал технической физики. 2013. Т. 39, вып. 18 С. 53-60.
13. Громов Д.Г., Боргардт Н.И., Волков Р.Л. и др. Особенности структуры и свойств углеродных наностолбиков, сформированных низкотемпературным осаждением из газовой фазы // Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА. – 2013. – № 2. С. – 42-48.
14. Волков Р.Л., Боргардт Н.И., Кукин В.Н. и др. Электронно-микроскопические исследования монокристаллических включений в углеситалле // Известия РАН. Серия Физическая. – 2013. – Т. 77, № 8. – С. 1076–1081.

